

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Avda. Séneca, 2
28040 Madrid
www.ucm.es



Dr. Juan Tinguaro Rodríguez González, con nif nº 78561506 S y Dra. Rosa Alonso Sanz con nif nº 03464665 Z como Profesores del *Departamento de Estadística e Investigación Operativa I de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid*

MANIFIESTAN

Que somos miembros del Equipo Investigador sobre *Modelos estadísticos para la predicción de variaciones en la valoración de inmuebles*, cuyo proyecto ha sido realizado en la citada Universidad bajo el marco del Art.83 de la LOU (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) y en colaboración con la empresa Aplicaciones Estadísticas y Consultoría, S.L., según contrato suscrito entre las partes de 15 de Mayo del 2.016.

Que Aplicaciones Estadísticas y Consultoría, S.L. dispone desde el año 2.008 de un Modelo de Valoración Automatizada (AVM) para Viviendas ubicadas en todo el territorio nacional, y que dicho modelo incluye un Sistema de Medición de la Fiabilidad (SMF) que mide de manera semestral y anual la fiabilidad de los valores automáticos obtenidos por el citado Modelo de Valoración Automatizada, en contraste con los valores de mercado obtenidos en valoraciones con visita física a las viviendas efectuadas por Sociedad de Tasación inscrita en el Banco de España, y en base a ello,

CERTIFICAN

Que Aplicaciones Estadísticas y Consultoría, S.L. nos ha contratado para la verificación del uso y la fiabilidad (SMF) de su Modelo de Valoración Automatizada (AVM), obteniéndose durante el primer semestre del año 2017 los siguientes parámetros de fiabilidad:

RESULTADOS FIABILIDAD PRIMER SEMESTRE AÑO 2.017		
	AVM	Tasaciones
Valores Obtenidos €	4.243.415.169	4.192.538.535
Coficiente de Variación Total		1,21%
Coficiente de Variación Media		4,05%
Coficiente de Variación Absoluta		17,44%

Y para que así conste, a los efectos oportunos, firmamos la presente certificación en Madrid a 10 de octubre de 2017:

Rosa Alonso Sanz

J. Tinguaro Rodríguez González

